

**雙通道速率/厚度監測器**

Fil-Tech, Inc. 的 SQM-200 是下一代的速率/厚度監測器。SQM-200 可執行過去只有在較昂貴及較複雜的控制器中才有的功能，是半自動化沈積控制與監測的絕佳儀器。SQM-200 能夠處理簡單的單一感測器工序以及更複雜的共沈積與合金工序。SQM-200 配備高對比液晶顯示器以及直覺式的捲動方塊 / 選單系統。SQM-200 在設計上也非常方便使用者操作，在操作螢幕上有例如「線上說明」、「上下文特定選單」和「提示」等功能。

**功能**

- 與我們的控制器具有相同的高速、高精確度的測量引擎
- 即使在極低的速率，時間平均仍可提供絕佳的精確性
- 在大型腔體或是在使用行星型夾具時空間平均可提供絕佳的精確性
- 獨立模式可使得 SQM-200 以兩台完全獨立的監測器形式運作
- 擋板延遲可提供精確的薄膜品質控制
- 能夠進行速率取樣，大幅延長厚度較大薄膜的晶體壽命
- 先進的合金模式包括連結的擋板延遲功能
- 「時間/功率」功能使得薄膜即使在晶體失效的情況下仍然能夠完成
- 速率、厚度和速率偏差圖形
- 以質量或厚度為單位顯示
- 8 個可程式的數位輸入，8 個可程式數位輸出，以及 4 個類比輸出

**Fil-Tech, Inc.**

6 Pinckney St., Boston, MA 02114

617-227-1133 電話

617-743-1743 傳真

800-743-1743 電話

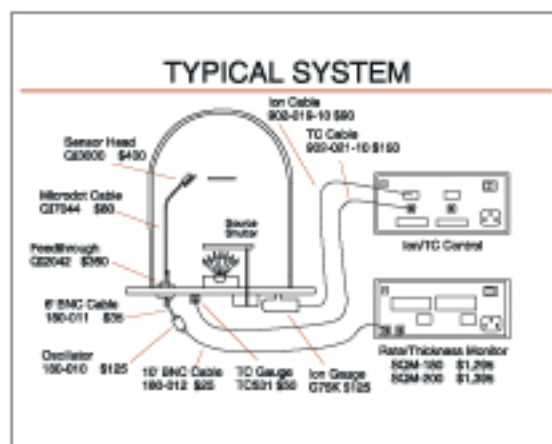
www.filtech.com  
sales@filtech.com

**雙通道速率/厚度監測器**

<p>多重模式操作</p>	<p>單一薄膜模式 ("simple")                  備份模式 (晶體切換)                  空間平均模式                  合金模式                  獨立模式 (兩台監測器)</p>
<p>厚度解析度 (無平均)                  速率解析度 (無平均)                  厚度解析度 (50 取樣平均)                  速率解析度 (50 取樣平均)</p> <p>高精確度</p> <p>高速                  測量範圍</p>	<p>0.0133Å / 測量                  0.133Å / 秒                  0.002Å / 測量                  0.02Å / 秒</p> <p>0.03 Hz/測量, 2 ppm 相對</p> <p>每次十次測量                  500KÅ 鋁當量</p>
<p>類比輸出功能                  四個 -10 至 +10V 類比輸出</p>	<p>電腦控制                  速率                  速率偏差                  厚度</p>
<p>繼電器輸出 (可任意指定)                  八個 1.5 安培 SPST 常開接點</p>	<p>手動 (前面板)                  源擋板                  基板擋板                  晶體擋板                  晶體失效                  設定點時間                  設定點厚度                  良好速率                  電腦控制</p>

**訂購資訊**

- SQM-200 速率/厚度監測器
- 200-010 遙控類比振盪器
- 200-011 6" BNC 纜線 (公/母接頭)
- 200-012 10' BNC 纜線 (母/母接頭)
- QI8010 石英晶體黃金 6MHz 10/片
- QI8008 石英晶體合金 6MHz 10/片
- QI3000 感測器頭 (一個)
- QI7044 30.75" Microdot 纜線
- QI2042 鎖穿 1" 螺栓



**Fil-Tech, Inc.**

6 Pinckney St., Boston, MA 02114

617-227-1133 電話  
 617-743-1743 傳真  
 800-743-1743 電話

www.filtech.com  
 sales@filtech.com